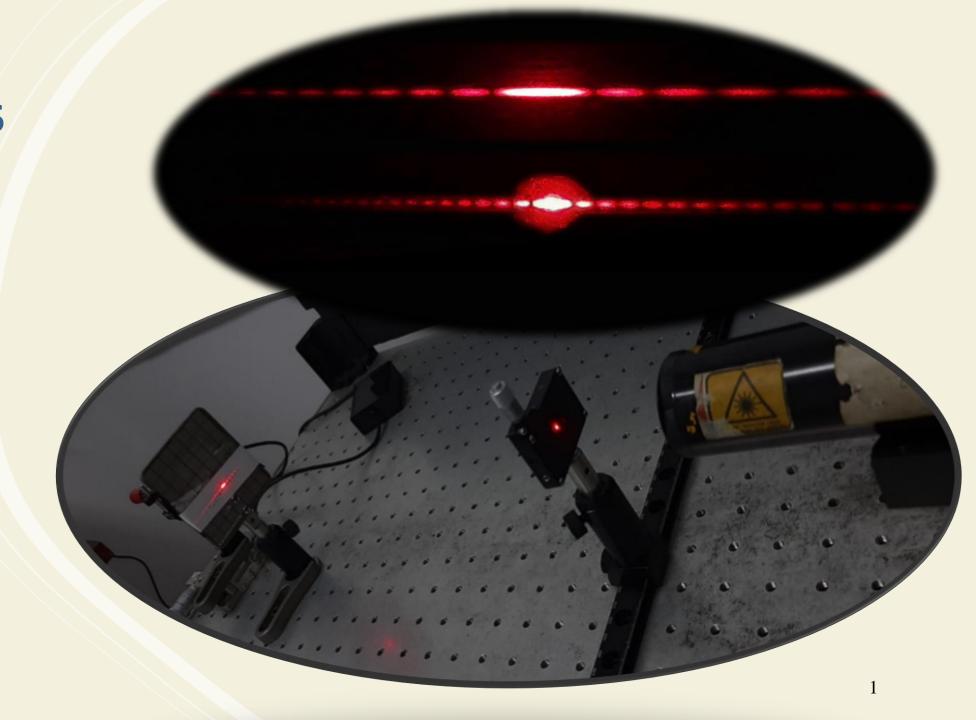
Laboratorio 2 1er cuatr. 2025

Clase 8
28/06/2025
Óptica (2)
Difracción



- ✓ En la clase pasada nos hemos introducido en la característica ondulatoria de la luz presentándola como una onda electromagnética.
- ✓ Nos dedicamos a analizar un laser como fuente de luz monocromática y coherente. En particular nos centramos en el diodo laser.
- ✓ También nos hemos familiarizado con el uso de fotodetectores.
- ✓ Hemos verificado el concepto de transmitacia cuando usamos filtros.
- Hemos caracterizado la polarización del diodo laser del laboratorio.
- ✓ Comprobamos la Ley de Malus.

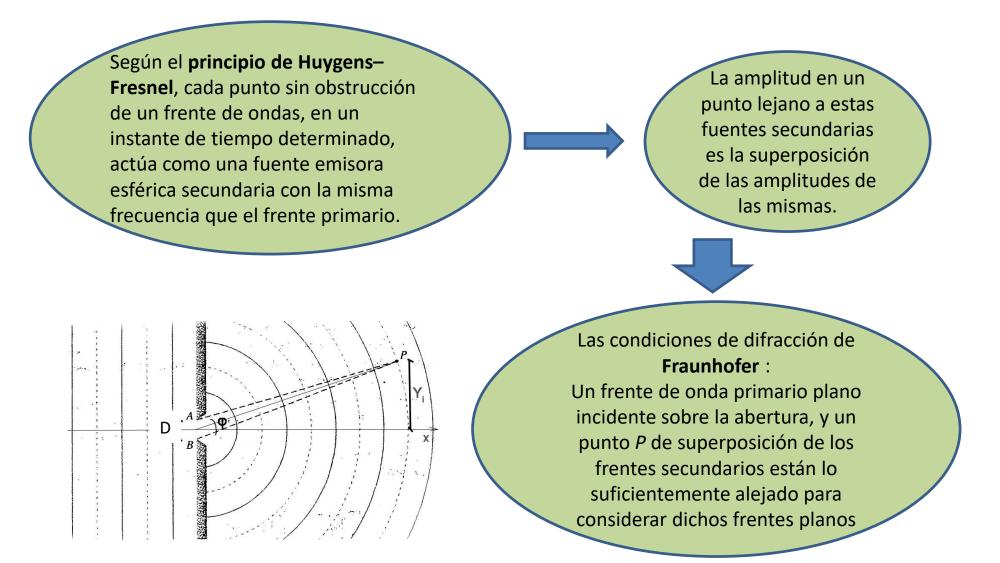
- ✓ Hoy continuaremos con el estudio de ondas luminosa y nos introduciremos en el fenómeno de difracción.
- ✓ Analizaremos la difracción considerando los cambios que se observan en la imagen generada por un objeto difractante cuando la observación se realiza bajo diferentes condiciones experimentales.
- ✓ Mostraremos el formalismo en las condiciones de campo lejano (Fraunhofer).
- ✓ Realizaremos experiencias que permiten verificar la difracción de campo lejano :

Difracción por una rendija

Difracción por un filamento

√ ¿Son complementarias?

Hoy realizaremos la experiencia de **Difracción por una rendija**. La idea es explorar el diagrama de difracción en condiciones de Fraunhofer (campo lejano).



Rendija de ancho D D/2Δyi[, -D/2

Partimos de una fuente continua lineal coherente (es decir un continuo finito de ondas secundarias coherentes para una rendija larga).

Cada fuente secundaria del continuo emite una onda esférica cuyo campo eléctrico se puede escribir

$$E = \left(\frac{\varepsilon_0}{r}\right) \operatorname{sen}\left(\omega t - kr\right)$$

 ε_0 = eficacia de la fuente

r = distancia del elemento Δy de la rendija hacia la pantalla de observación.

N = número de fuentes

 $\Delta y_i \frac{N}{D}$ Numero de fuentes en el segmento Δy_i

 $M = Número de segmentos \Delta y_i$

$$E_{i} = \left(\frac{N\Delta y_{i}}{D}\right) \left(\frac{\varepsilon_{0}}{r_{i}}\right) \operatorname{sen}(\omega t - kr_{i}) \qquad \varepsilon_{L} = \frac{1}{D} \lim_{N \to \infty} (\varepsilon_{o}N)$$

Contribución del segmento i-esimo a la intensidad del campo eléctrico

$$\varepsilon_{L} = \frac{1}{D} \lim_{N \to \infty} (\varepsilon_{o} N)$$

$$E = \sum_{i=1}^{M} \frac{\mathcal{E}_L}{r_i} \operatorname{sen}(\omega t - kr_i) \Delta y_i$$

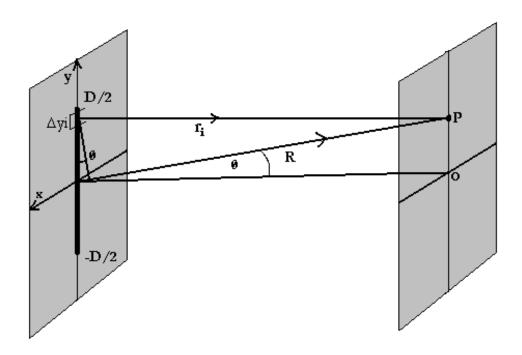
eficacia de la fuente por unidad de longitud

Campo eléctrico neto en P

Imponiendo la condición de fuente continua ($\Delta y_i \rightarrow 0$, $M \rightarrow \infty$) la suma se convierte en la integral:

$$E = \sum_{i=1}^{M} \frac{\mathcal{E}_L}{r_i} \operatorname{sen}(\omega t - kr_i) \Delta y_i$$

$$E = \sum_{i=1}^{M} \frac{\mathcal{E}_{L}}{r_{i}} \operatorname{sen}(\omega t - kr_{i}) \Delta y_{i} \qquad \qquad E = \mathcal{E}_{L} \int_{-D/2}^{+D/2} \frac{\operatorname{sen}(\omega t - kr)}{r} dy \qquad \qquad r = r(y)$$



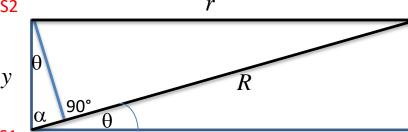
P está muy lejos de la rendija (fuente lineal coherente):

$$R \gg D \longrightarrow r(y)$$
 nunca se desvía mucho de su valor medio R

$$dE = \frac{\mathcal{E}_L}{R} \operatorname{sen}(\omega t - kr) dy$$

Contribución del segmento ∆y al campo eléctrico en P

La fase es mucho más sensible a la variaciones de r(y)que la amplitud



$$180^{\circ} = 90^{\circ} + \alpha + \theta$$

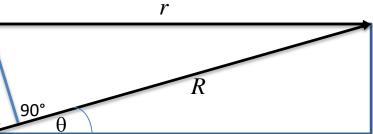
$$\alpha = 90^{\circ} - \theta \longrightarrow \cos\alpha = \sin\theta$$

$$\longrightarrow cos\alpha = sent$$

 $E = \varepsilon_L \int_{-D/2}^{+D/2} \frac{\operatorname{sen}(\omega t - kr)}{r} \, dy$

$$E = \frac{\varepsilon_L}{R} \int_{-D/2}^{+D/2} \operatorname{sen}\left[\left(\omega t - k\left(R - y \operatorname{sen}\theta\right)\right)\right] dy \qquad \Longrightarrow \qquad E = \frac{\varepsilon_L D}{R} \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right) \sin\left(\omega t - kR\right) \qquad \beta(\theta) = \left(\frac{kD}{2}\right) \sin\theta$$

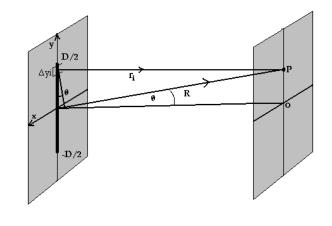
Entonces la irradiancia es $I(\theta) = \langle E^2 \rangle$



Aplicando la ley de cosenos al triángulo S1 S2

$$r^2 = R^2 + y^2 - 2Ry\cos\alpha$$

$$\frac{r}{R} = \left[1 + \left(\frac{y}{R}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{R}\right)sen\theta\right]^{1/2}$$



aplicando series de Maclaurin

$$r = R - y \sin \theta + (y^2/2R)\cos^2 \theta + \dots$$



$$r \approx R - y \sin \theta$$

Resolviendo la integral

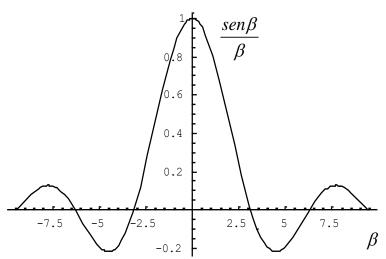


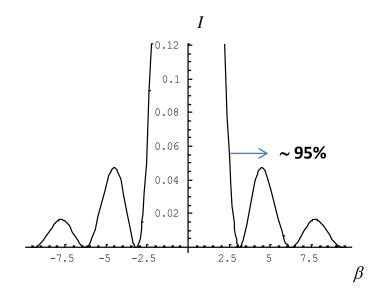
$$E = \frac{\varepsilon_L D}{R} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \sin \left(\omega t - kR \right)$$

$$\beta(\theta) = \left(\frac{kD}{2}\right)\sin\theta$$

$$I = I_o \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2 \qquad I_o = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon_L D}{R}\right)^2$$

$$I = I_0 \frac{sen^2 \beta}{\beta^2}$$

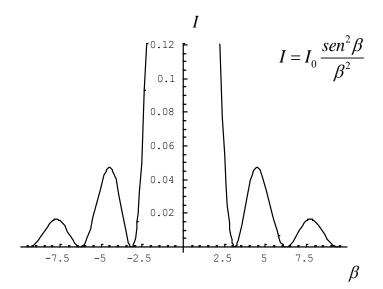




$$\frac{dI}{d\beta} = 0 \qquad \frac{dI}{d\beta} = I_o \frac{2\sin\beta(\beta\cos\beta - \sin\beta)}{\beta^3} = 0 \qquad \begin{cases} \beta = \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi \\ \beta = \tan\beta \end{cases}$$

$$\beta(\theta) = \left(\frac{kD}{2}\right)\sin\theta$$

De la posición de máximos y mínimos se obtiene θ y luego conociendo β y λ se puede evaluar el ancho de la ranura.



$$\beta=\pm\pi,\pm2\pi,\pm3\pi$$

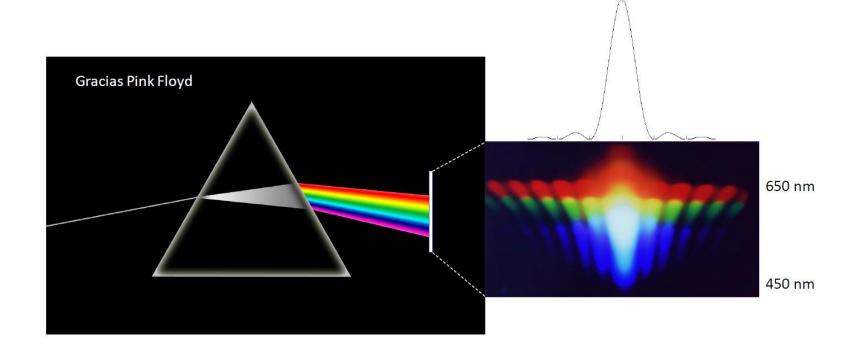
$$\beta = \tan \beta$$

$$\beta(\theta) = \left(\frac{kD}{2}\right)\sin\theta$$





La posición de máximos y mínimos depende de la longitud de onda λ



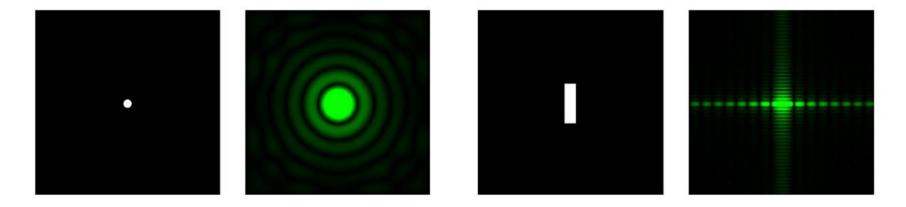
Algunas propiedades la Transformada de Fourier

- La figura de difracción es la transformada de Fourier de la fuente.
- Es inversamente proporcional al tamaño del objeto.
- Es directamente proporcional a la longitud de onda.

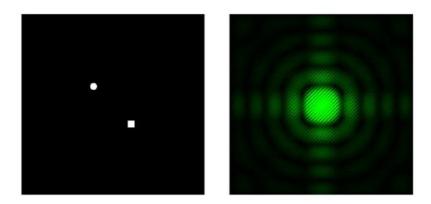
Cambio de tamaño del objeto difractor Cambio de longitud de onda

Algunas propiedades la Transformada de Fourier

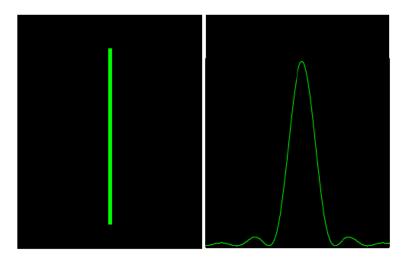
• La Transformada de Fourier del objeto difractor obviamente depende de la forma del mismo.

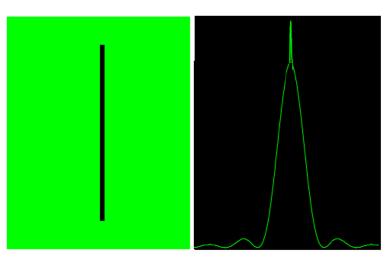


• El centro de la Transformada de Fourier sólo depende de la posición de la fuente (corresponde a la imagen de la misma) y no de la ubicación del objeto difractor.



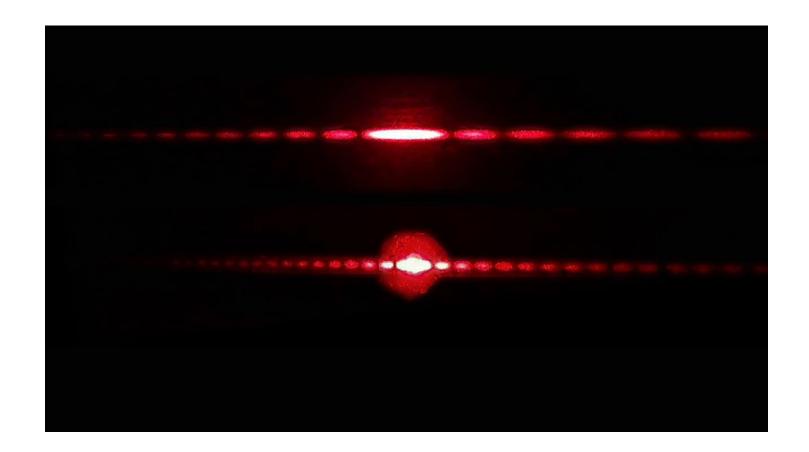
Objetos complementarios tienen la misma figura de difracción





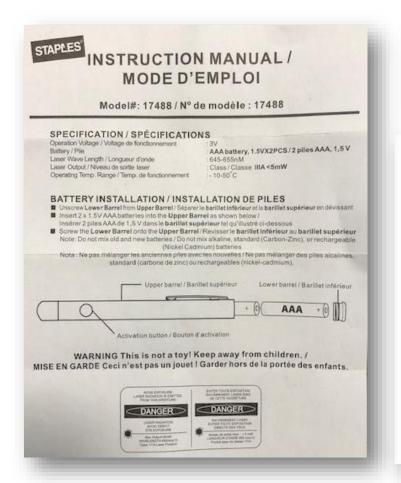
Objetivo de la experiencia

- Verificar si objetos complementarios tienen la misma figura de difracción.
- ¿ Son similares las figuras de difracción producidas por un alambre y una ranura?
- ¿ Hay algún ancho de la ranura para el cual ambas figuras coincidan?
- ¿ Será válida la ecuación que describe el ancho de una ranura en función de λ , D, R para calcular el diámetro del alambre?





Materiales para la experiencia







Specifications

Resolution:

13-bit (with SensorDAQ)

0-600 lux: 0.1 lux 0-6000 lux: 1 lux 0-150000 lux: 25 lux

12-bit (with LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro, Go! Link, EasyLink,

TI-Nspire Lab Cradle, ULI, or Serial Box Interface)

0-600 lux: 0.2 lux 0-6000 lux: 2 lux 0-150000 lux: 50 lux

10-bit (with CBL 2)

0-600 lux: 0.8 lux 0-6000 lux: 8 lux 0-150000 lux: 200 lux

Stored calibration values

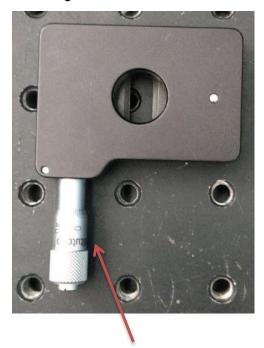
0-150000 lux

0-600 lux slope: 154 lux/V intercept: 0 lux 0-6000 lux slope: 1692 lux/V intercept: 0 lux

slope: 38424 hxx/V

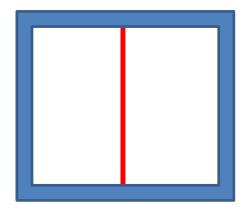
intercept: 0 lux

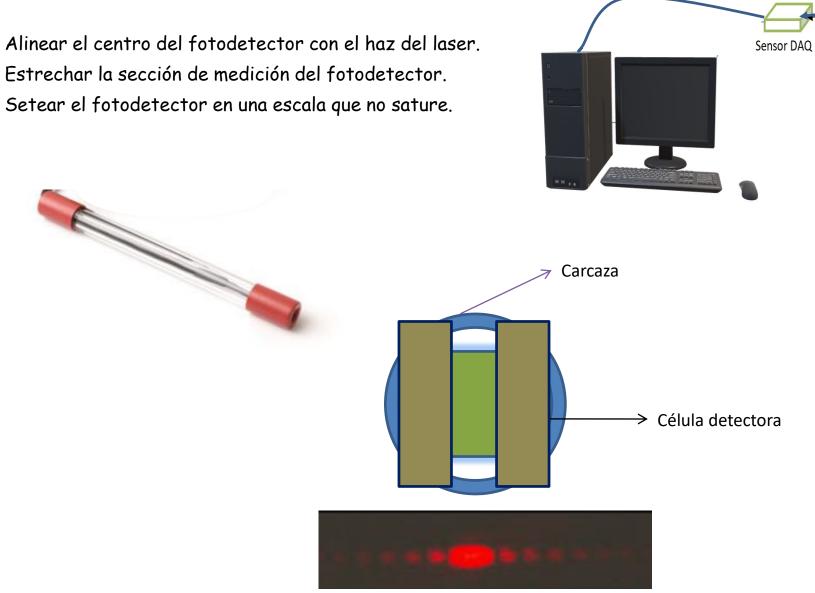
Rendija de ancho variable

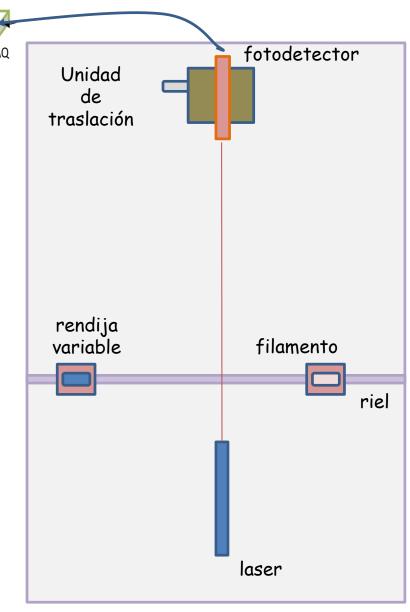


Tornillo micrométrico

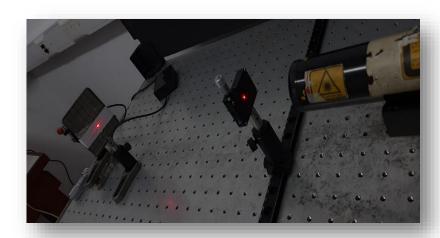
Filamento

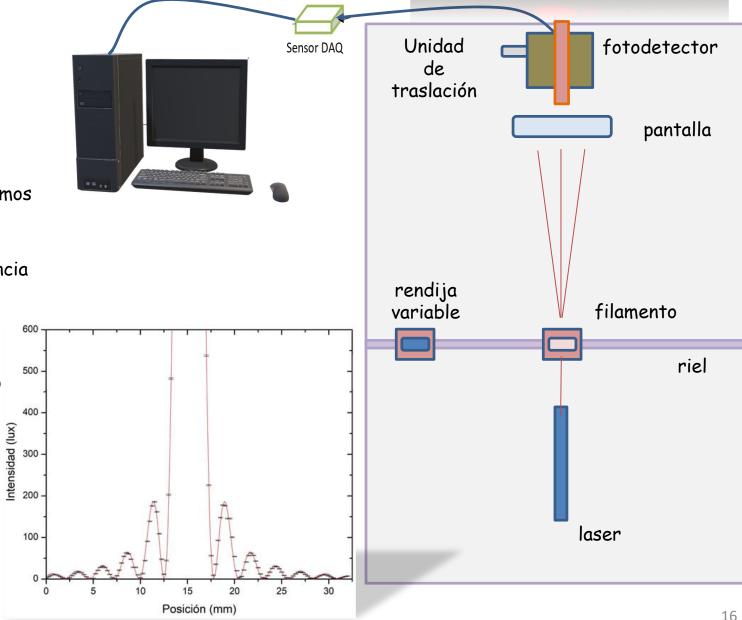






- Montar el filamento en el riel y alinearlo con el haz del laser.
- Obtener la figura de difracción en la pantalla.
- Marcar los máximos de intensidad en la hoja cuadriculada.
- Medir la distancia del filamento a la pantalla.
- Estimar el diámetro del alambre a partir de la teoría.
- Desplazar el filamento del centro del riel y colocar la rendija.
- Variar la apertura de la rendija hasta obtener los mismos máximos de intensidad en la pantalla.
- Retirar la pantalla y desplazar el fotodetector para levantar el perfil de difracción en función de la distancia (moviendo la unidad de traslación).
- Realizar lo mismo con el alambre.
- · Comparar ambas figuras de difracción.
- Estimar el diámetro de la rendija del ajuste al modelo





Medición del diámetro del alambre

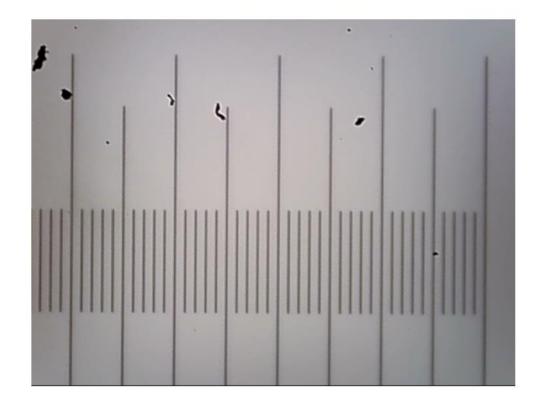


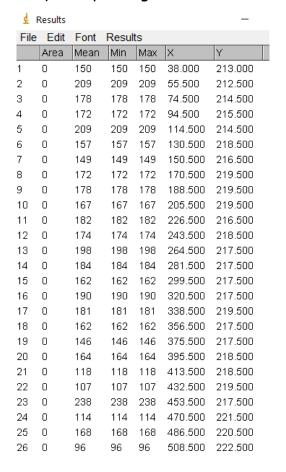
Fig 9.A. Foto capturada por la cámara del microscopio de la regla graduada de 10 μm

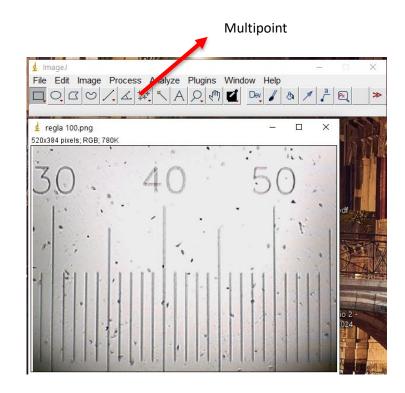
- Se utiliza un microscopio con cámara digital conectado a una PC
- Se toma una foto de una regla graduada con aumento establecido en el microscopio.
- Con el uso de ImageJ se calibra la relación entre una longitud y el número de pixeles.
- Sin cambiar el aumento del microscopio, se toma una foto del alambre usado en la práctica.
- Se estima el diámetro del alambre



Fig 9.B. Foto capturada por la cámara del microscopio del alambre utilizado

- 1. Importar la imagen de la regla en Image J.
- 2. Presionar Multipoint.
- Con el cursor ubicarse en un punto de la regla (puede ser la primera a la derecha) y dar click.
- 4. Desplazarse al segunda línea y repetir.
- Hacer esto hasta la última línea.
- Ir a Analize → Measurements y se despliega una tabla que se puede grabar como .csv





- 7. La distancia entre líneas corresponde 100 micrones. Y cada línea avanza 100 micrones respecto de la anterior
- 8. Graficar pixeles vs distancia (X)
- 9. La pendiente de la recta es la constante de calibración

